Searching PAJ Page 1 of 2

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-159922

(43) Date of publication of application: 20.06.1997

(51)Int.CI.

G02B 21/06 GO1N 37/00

(21)Application number: 07-324897

(71)Applicant: KAGAKU GIJUTSU SHINKO

**JIGYODAN** 

(22)Date of filing:

13.12.1995

(72)Inventor: TOKUNAGA MAKIHIRO

ca s

SAITO KIWAMU YANAGIDA TOSHIO

## (54) PHOTOIRRADIATION SWITCHING METHOD

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To facilitate the switching and the concurrent use of vertical illumination and total reflection illumination methods useful for a lens optical system with a simple optical system by easy operation by moving a mirror reflecting irradiating light and switching illumination.

SOLUTION: The illumination method is made switchable only by moving the mirror (dichroic mirror, prism, etc.) 7. By moving the mirror 7 in a vertical illumination state (a), the state may be switched to a total reflection illumination state (c). The reflected irradiating light beams 6 and 5 are changed from the vertical illumination to the total reflection illumination by moving the mirror 7. The vertical illumination (a) and the total reflection illumination (c) are useful, especially, for a fluorescent microscope, and the total reflection illumination (c) and illumination at an appropriate angle are useful for a system using a probe as illumination for the tip of the probe. Thus, this method can be developed in study field

in micro world such as an interatomic microscope (AFM), a tunnel microscope (STM) or a photon STM (NSOM).

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

19.02.1998

[Date of sending the examiner's decision of

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] [Date of registration] 3093145

28.07.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許山壤公開發号

## 特開平9-159922

(43)公開日 平成9年(1997)6月20日

(51) Int.CL <sup>0</sup>	識別配号	庁内整理部号	PΙ		技術表示體所
G02B 21/0	6		G 0 2 B	21/08	
G01N 37/0	0		G01N	37/00	В
					F

### 密査部球 京部球 部球項の数7 OL (全 6 四)

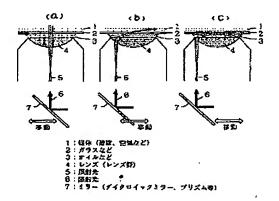
(21)出顧番号	<b>特顯平7 - 324997</b>	11.07	120800 技術提與事業団
(22)出顧日	平成7年(1995)12月13日	,,,,	级川口的本町4丁目1番8号
		(72) 究明者 德永 大阪	: 万喜洋  病吹田市千風山月が丘11-3
		(72)発明者 藻酸 大阪 1108	的邓市中首舌烏町 6 —998—3—5—
			鉄雄 県川西市けやき坂 2 ―45― 8
		(74)代理人 弁理	土 西岸 利夫

## (54) 【発明の名称】 光照射切り替え方法

### (57)【要約】

【課題】 光照射の光路を、簡単な光学系と、簡単な操作で切り替え可能とし、蛍光顕微鏡等において、箱射照明と全反射照明との併用や切り替えを容易とする。

【解決手段】 照射光を反射するミラーを移動させて、 レンズ光学系での光照射光路を切り替える。



(2)

### 【特許請求の範囲】

【語求項1】 レンズ光学系での光照射の光路切り替え の方法であって、照射光を反射するミラーを移動させる ことによって切り替えることを特徴とする光照射切り替 え方法。

【語水項2】 複数のミラーにより光照射光路を形成す る光学系において、少くとも一つのミラーを移動させる 請求項1の方法。

【韻求項3】 光学系が顕微鏡であり、落射照明と全反 射照明との併用と切り替えを行う請求項1または2の方 10

【 目求項4 】 顕微鏡が蛍光顕微鏡、原子間力顕微鏡、 トンネル顕微鏡。またはフォトントンネル顕微鏡である 請求項3の方法。

【請求項5】 光学系が微小針によるナノメートル計測 系である請求項2の方法。

【語求項6】 語求項1ないし5のいずれかの方法の実 施のための機構であって、ミラーの直線移動機構を備え ていることを特徴とする光照射切り替え機構。

照明用レンズが配置されている請求項1ないし5のいず れかの方法のための対物レンズ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、光照射切り替え 方法に関するものである。さらに詳しくは、この発明 は、顕微鏡等のレンズ光学系において、照射光の光路を 簡便に切り替え、ミクロの次元と領域での観察を容易と することのできる新しい光照射切り替え方法に関するも のである。

[0002]

【従来の技術とその課題】従来より、顕微鏡、特に蛍光 顕微鏡の分野においては、落射照明と全反射照明との、 併用やその切り替えを簡単な方法で可能とすることが望 まれていた。それと言うのも、原子間力顕微鏡(AF M)、トンネル顕微鏡(STM)、フォトンSTM(N SOM)、微小ガラス針によるナノメートル計測法等 の、ミクロの次元や領域を対象とする場合の照明では、 全体的な像観察とともに、局所的でかつ1分子・原子レ ベルの観察が必要とされているからである。

【0003】たとえば蛍光顕微鏡の照明として、現在一 般的に使われている落射照明方法についてみると、図1 に示したように、光源(水銀ランプまたはレーザー)か ちの光を投光管を経て、ダイクロイックミラーで照射光 を反射させ(蛍光は透過させる)、対物レンズの中央に 入射させて試料面を照射している。また、ガラス表面近 傍のみを局所的に照明する方法として全反射照明が知ら れているが、これは、ごく限られた利用のみでほとんど 使われていないが、全反射したガラス表面から試料溶液

2 m程度)を使って照明するもので、図2に示したように プリズムを使う方法と、図3のように対物レンズを使う

方法とがある(参考文献: Daniel Axelrod.Meth. Cell. Biol. 30, 245-270 (1989)), 【0004】図3に示した対物レンズを使う方法では、

関口数(NA)が下記の式を満たす対物レンズにより全 反射照明が可能とされている。

NA>n

NA:対物レンズの関口数

n: 試料溶液の屈折率

ただし、この方法では、対物レンズ内で光が散乱しない ように入射することが重要である。

【0005】そして、これらの方法については、最近、 落射蛍光法の改良と、プリズムを使った全反射照明によ り、蛍光色素1分子の観察が可能となってもいる(参考 文献:T.Funatsu et al., Nature, 374, 555-5 59 (1995))。また、全反射照明法では、バック グラウンド・ノイズ (飲乱光など) が極めて低く、たと えば、蛍光色素1分子のような観察にも大変有効である 【語求項7】 中央部の結像用レンズの周縁部に全反射 26 ことがわかってきている(照明が局所的であるという制 約がある)。

> 【0006】しかしながち、従来、一般的には、対物レ ンズを使った全反射照明は投光管を経由することによる 光学設計の点や、対物レンス内での散乱が予想され、営 光色素 1 分子の観察に利用できることは考えられていな かったため、さらには、対物レンズによる全反射照明そ のものの有用性が認識されていなかったために、特に専 用の対物レンズは存在せず、通常の油浸対物レンズで高 い開口数を有するものが使われているのが現状である。 このため、全反射照明の有用性が高まるにつれ、対物レ ンズによる全反射照明について適切なレンズや手法等の 光学系を用意することで、その有用性をさらに生かすこ とが考慮されねばならない状況にある。

【0007】とのような状況において、全反射照明法の 特徴と利点を生かして落射照明と組合わせることが試み **られているが、そのための適切な光学系については依然** として多くの改善すべき点が残されている。特に指摘さ れるべきことは、落射照明とプリズム使用の全反射照明 とを組合わせ、その併用と切り替えにより全体像観察と 40 局所的な観察を行う従来の試みでは、両者の照射光は疑 微鏡入射前でいったん2つの光に分かれ、別々の光路を 経由して照明され、両者の切り替えには、シャッター・ ミラー等が使われていることである。このような光学系 の構成では、落射照明には投光管、全反射照明にはブリ ズムと、それぞれ専用の光学系が必要であり、さらに、 2光路分岐および切り替え用の部品も必要とされてい て、全体的に、かなり複雑で、しかも面倒な操作が必要 とされる底様となっているのである。

【0008】そこで、この発明は、以上の通りの従来の 側にしみ出す光であるエバネッセント光(葎さ100m~50~技術における問題点を解消し、簡単な光学系と、簡便な (3)

操作で、黄光顕微鏡等のレンズ光学系に有用な、幕射照 明と全反射照明方法との、併用と切り替えをも容易とす る。新しい照射光光路の切り替え方法を提供することを 目的としている。

3

#### [00009]

【課題を解決するための手段】この発明は上記の課題を 解決するものとして、レンズ光学系での光照射の光路切 り替えの方法であって、照射光を反射するミラーを移動 させることによって切り替えることを特徴とする光照射 切り替え方法を提供する。また、この発明は、複数のミ 10 ラーにより光照射光路を形成する光学系において、少く とも一つのミラーを移動させる方法をも提供する。

【①①10】そして、この発明は、光学系が顕微鏡であ り、藉財照明と全反射照明との併用と切り替えを行う方 法や、顕微鏡が蛍光顕微鏡、原子間力顕微鏡、トンネル 顕微鏡、またはフォトントンネル顕微鏡である方法、光 学系が微小針によるナノメートル計測系である方法等を その感憶として提供する。さらにまた、この発明は、上 記のいずれかの方法の実施のための機構であって、ミラ ーの直線移動機構を備えていることを特徴とする光照射 20 切り替え機構も提供する。

【0011】この発明は、以上のとおりの簡単な光学系 と操作で、試料側(レンズの上側)に、何ら光学系を必 要とせずに、探針等を持ち込む作業空間を確保し、落射 照明と全反射照明との併用・切り替えを可能としている のである。

### [0012]

【発明の実施の形態】以下、詳しくとの発明の方法、さ ちにはそのための機構について説明する。まず、この発 明の基本的原理については、たとえば添付の図4により 35 場合も含めて)。 説明することができる。すなわち、この図4に例示した ように、この発明の方法では、ミラー(ダイクロイック ミラー、プリズム等)(?)の移動のみで照射の仕方を 切り替え可能としている。

【0013】図4(a)は落射照明の状態を示してお り、ミラー (?) を移動させることで、図4 (c) の会 反射照明の状態に切り替えることができる。ミラー (7)の移動によって、反射された照射光(6)(5) は、 藉射照明から全反射照明へと変化する。 図4 (8) の藉射照明、そして図4 (c)の全反射照明は、蛍光顕 40 を介して取出し、カメラにより鏝像する。そして、この

**微鏡において特に有用であり(真旋倒1、2、3参** 照) また、図4 (c)の全反射照明や図4 (b)の標 な適当な角度の照明は、原子間力顕微鏡のような探針を 使った系において、探針の先端の照明に有用でもある (寅銘例4、5参照)。

【0014】なお、図4 (a) (b) (c) は、ミラー (?)を直接移動させているが、このようにミラー

(?)を移動させなくとも、ミラー(?)により照明光 (6) が反射される位置を、光源からの照射光の照射位 置の移動によって変えてもよいことは言うまでもない。

実際には、このような反射位置の変更による方法が、実 施門にも示したように光学系の構成としては現実的でも

【0015】図4に示した全反射照明のためのレンズと しては、関口数(NA)が下記の式を満たしさえすれば LL.

#### NA>n

NA:レンズの開口数

n:レンズと反対側の媒体(l)の屈折率

ここでの全反射照明を営売顕微鏡に用いれば、高いS/ N (像が明るく背景が暗い) の像が得られ、蛍光色素1 分子の観察が可能となる(実施例1.3を照)。

【0016】また、ミラー(7)の切り替えと同時に、 集光用レンズ等の光学部品を切り替えることも考えられ るが、基本的にミラー (7) の操作によって照明系を変 化させることになる。集光用レンズ等の配置に副約は急 いが、操作するミラー(7)よりも光源側に集光用レン ズを配置することにより光学系が簡単となる場合が多い (実施例参照)。

【0017】また、図5に倒示したように、新しい対物 レンズを用いることにより、さらに高いS/Nの全反射 照明を行うことが可能となる(実施例2参照)。この例 では、照明用部分と結像用部分とを区切ることを本質的 な特徴としている。照明の散乱光や迷光が結像側に揚れ ないため、背景光が減少し高いS/Nを実現する。

【0018】もちろん、照明用のレンズやミラーの組合 わせは、レンズ、ミラー、プリズム等により程々の光学 設計としてよく、照明用のレンズの魚点距離も目的によ り変えることができる(1mm、すなわちレンズでない

#### [0019]

【実能例】以下、実施例によりさらに詳しくこの発明の 寒能の形態について説明する。

〈実施例1〉図6は、この発明の照射切り替え方法を覚 光顕微鏡に適用した例を示したものである。

【0020】照射光源(レーザー)からの光を暴光用レ ンズを介してミラーで反射させ、さらに反射された照射 光をダイクロイックミラーにより反射させ、これにより 全反射を行い、試料からの蛍光をダイクロイックミラー 例のシステムでは、集光用レンズからの光を反射する光 源側ミラーを移動させることで、ダイクロイックミラー での照射光の反射位置を変化させ、通常の落射照明と全 反射照明との併用、切り替えを行っている。

【0021】このようにすることで、通常の落射照明と 全反射照明との切り替えを、ミラーの移動のみで簡単に 行うことができる。このシステムによる全反射照明の使 用により、溶液中の蛍光色素分子1個が通常のビデオ像 として観察できることになる。

(実施例2)図7は、図5に例示した特有のレンズを営

(4)

光顕微鏡で使用した例を示したものである。

【0022】この例では、結僚用レンズと全反射照明用 レンズとにより構成された対物レンズを用いて実施例1 と同じ営光顕微鏡システムを形成している。対物レンズ 内での照射光の散乱等がないため、実態例1よりも背景 光が少なく、より良い像を与える字ができる。

(実能例3) 図8は、この発明の照明切り替え方法を原 子間力類微鏡に使用した例を示している。

【0023】原子間力疑微鏡 (AFM) に、蛍光顕微鏡 によりダイクロイックミラーでの照射光の反射位置を移 動させ、落射照明と全反射照明との併用や切換えを行う ようにしている。これにより、落射照明・全反射照明の 切り替えを可能とし、計測試料の蛍光観察を可能として いる。

【0024】AFMの他に、トンネル顕微鏡(ST M)、フォトンSTM(NSOM)、ガラス做小針を使 ったナノメートル計測装置などの、原子分子レベルの計 割技術に、同様にこの発明の方法を適用することが可能 計測試料の営光観察としては、まず落射照明により一般 的な蛍光像を得る。次に、全反射照明により局所的な (ガラス表面から約100 nmの深さまで)像を、蛍光 色素分子1個が見えるような高いS/N (Signal/Nois e: 像が明るく背景が暗い) で得る。

〈実能例4〉図9は、深針先端の観察を可能とするシス テムを例示したものである。

【0025】探針を使った計測システム(AFM、ST M. NSOM. ナノメートル計測技術など》に、この発 明の方法を適用し、探針先端のみの酸察を可能としてい 30 る。全反射照明によるエバネッセント光は、ガラス表面 から深さ約100mm程度までしかしみ出さないので、 探針先端のみの蛍光像観察が高いS/Nで可能となる。 一方、落射厩明では、探針全体が厩明されるため先進の みの観察が難しい。

【0026】なお、図9には、蛍光像観察のシステムを 記載してあるが、次の哀緒倒ちのように散乱光の観察シ ステムを用いることにより、全反射照明による探針先端 からの散乱光の観察が可能となる。そして、上記のいず れの場合にも、蛍光強度あるいは散乱強度から、探針の 40 蛍光顕微鏡システムを組み合わせた概略図である。 ガラス表面からの距離を知ることもできる。

〈夷焔例5〉図10は、斜光照明により探針先端領域の

観察を可能とするシステムを例示したものである。

【0027】探針を使った計勘システム(AFM、ST M. NSOM. ナノメートル計測技術など)に、この発 明の方法を適用し、探針先端領域の頽察を可能とした系 である。全反射となる手前の位置にミラーをおいた場 台、照明光は試料溶液中では図の様に斜め方向となり、 先端領域の照射が可能となる。

5

【0028】照明角度を適宜選択することにより、照射 領域を変えることが可能となる。なお、図10には、飲 を組み込み、実施例1および2と同様に、ミラーの移動(19)乱光観察のシステムを記載してあるが、前記裏舷例4の) ように営光観察のシステムとすることも可能である。そ して、散乱強度あるいは蛍光強度から、探針のガラス表 面からの位置を知ることもできる。

[0029]

【発明の効果】この発明により、以上詳しく説明したと おり、簡単な光学系と、簡単な操作により、顕微鏡技 衛、特に蛍光顕微鏡技術に有効な、落射照明と全反射照 明方法との、併用と切り替えが可能となる。さらに、原 子間方類微鏡(AFM)、トンネル顕微鏡(STM)、 である。より具体的には、この例では、ガラス表面上の 20 フォトンSTM(NSOM)等ミクロ世界の研究分野で の新しい展開が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】一般的な落射照明方法を例示した説明図であ

【図2】一般的な全反射照明としてのプリズムを使う方 法を例示した説明図である。

【図3】一般的な全反射照明としての対物レンズを使う 方法を例示した説明図である。

【図4】この発明の光照射の切り替え方法を例示した説 明図である。

【図5】この発明における新しい対物レンズを例示した 説明図である。

【図6】真施側としての蛍光疑微鏡での照射切り替え方

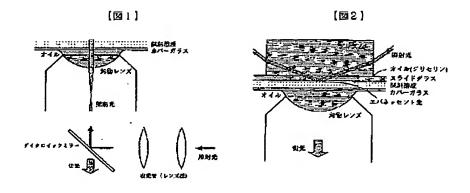
法を示した機略図である。 【図7】実施例としての蛍光顕微鏡での全反射照明用対

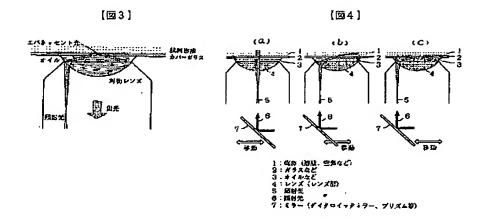
物レンズの使用例を示した概略図である。 【図8】真施倒としての原子間力顕微鏡での照射切り替

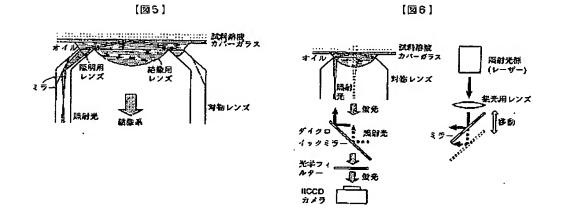
え方法を示した概略図である。 【図9】真施側としての探針計測システムとこの発明の

【図10】裏餡倒としての探針計測システムとこの発明 の照明システムを組み合わせた機略図である。

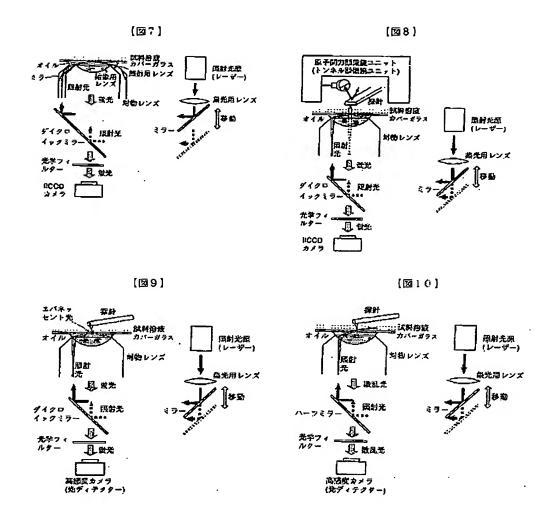








特関平9-159922



【手統領正書】

【提出日】平成8年1月23日

【手統箱正1】

【補正対象書類名】明細書

【捕正対象項目名】0025

【補正方法】変更

【補正内容】

【0025】探針を使った計測システム(AFM:ST

M. NSOM. ナノメートル計測技術など)に、この発明の方法を適用し、探針先端のみの観察を可能としている。全反射照明によるエバネッセント光は、ガラス衰面から深さ約100nm程度までしかしみ出さないので、探針先端のみの重光像観察が高いS/Nで可能となる。一方、落射照明では、探針全体が照明されるため先端のみの観察が難しい。